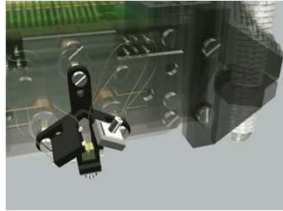


# OEM-AFMシステム

製品コード : AFM Scan Head & C3000 Controller



AFM走査ヘッド



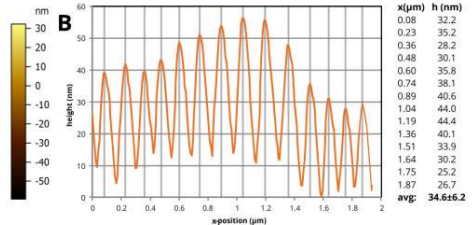
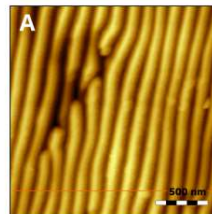
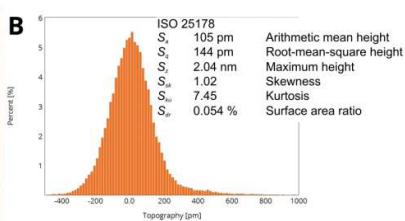
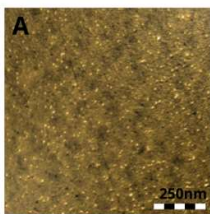
XYスキャナー(ピエゾ不要)



C3000コントローラー

## 材料研究と産業応用に適したコンパクト・マウンタブル原子間力顕微鏡

### ・ナノスケールでの定量的表面分析

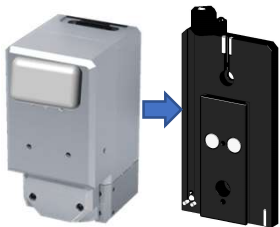


サブナノメートル粗さのガラス表面の画像(A)と統計分析(B)

ガラス中のナノスケールの波紋の画像(A)と高さプロファイル(B)※

※Maria Caterina Giordano & Francesco Buatier de Mongeot, Dipartimento di Fisica, Università di Genova (イタリア)

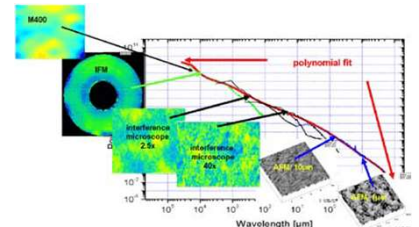
### ・コンパクトでイーゼーマウント及びインテグレーションが容易



AFM走査ヘッド構成 :

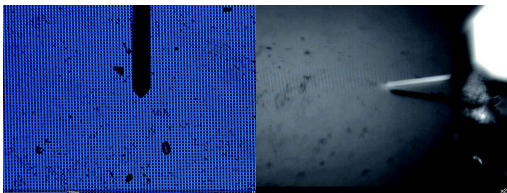
- ・XYスキャナー
  - ・2台xビデオカメラ
  - ・コースアプローチモーター
- ※マウントプレートで素早く再現性のある取付が可能。

AFM走査ヘッド&高精度クイックロックマウントプレート

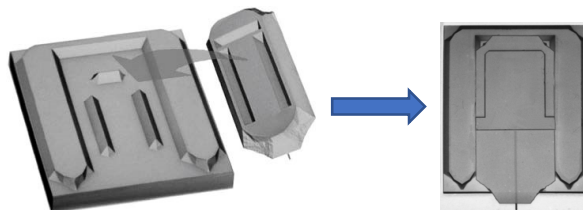


使用参考例 : ZEISS社シンクロトロン光学系の品質管理

### ・使いやすさを最適化して処理時間を節約



トップビューイメージ    サイドビューイメージ



アライメントチップ&カンチレバー    カンチレバーセット状態

トップビューカメラでサンプル表面の関心領域を特定し、45°の角度でセットされたサイドビューカメラでカンチレバーのコースアプローチが目視で容易にできます。

カンチレバーは、レーザーアライメント不要でアライメントチップに嵌めこむだけで簡単にセットできます。

### ・測定と分析の自動化

スクリプトインタフェースとバッチ測定手順を使用することで、サンプルに自動的に近づいて測定するルーチンの自動化が可能です。これは、自動ステージとの組み合わせの強力な手段になります。

### ・自動ステージとのカスタムソリューション(最上掲載写真 : AFM走査ヘッド)

上記掲載のシステムは、大きな凹面および凸面サンプルの粗さ測定を可能にするように構成されています。サンプルプラットフォームの360°の自動回転と、さまざまなサンプルの湾曲形状に対応するためのスキャンヘッドの自動開店を特長としています。